

# NanoVTEP G2 SingleProbe 0.16“ OTU-KS-NV-004-004-G2

产品 114387



直接訪問產品

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

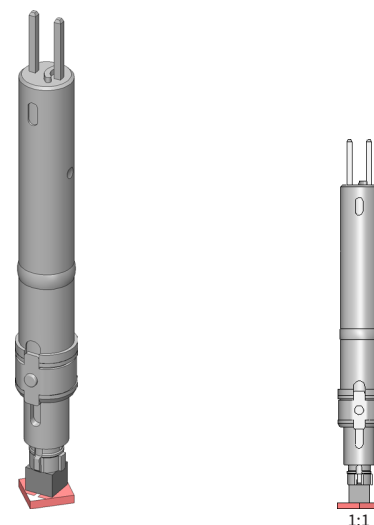
- 开路测试用组件,用于半导体芯片的电容式测试,检测其是否断裂、短路和存在焊接缺陷
- 适用于软件版本为 9.2 或更高的所有 Keysight 307x 测试系统
- 与 VTEP 技术相比,重复精度、测试覆盖率和故障检测能力均有提高

## 使用

nanoVTEP 探针用于集成电路的电容测试,可检查集成电路内部的接线接口是否存在断裂、短路和缺陷焊接。

nanoVTEP 探针是 Keysight 最新推出的无矢量 Opens 测试解决方案,取代之前的 VTEP 探针。除了重复精度、测试覆盖范围和故障检测能力大幅提高之外,新型 nanoVTEP 探针还能对微弱信号进行高达 40% 的放大,因为放大器位置靠近传感器板。

新型 nanoVTEP 只能与 nanoVTEP MUX 电路板配合使用。nanoVTEP 和 VTEP 探针可在一个测试治具中同时使用。

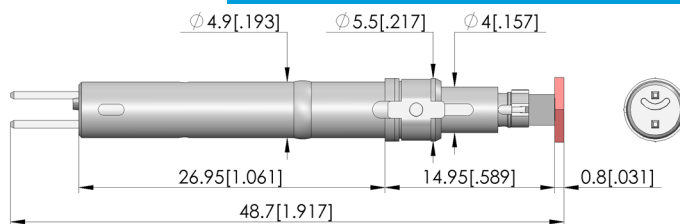
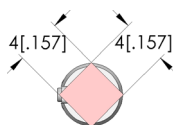


### 提示:

要正确扩展 Keysight nanoVTEP 探针,请使用扩展图 INFO 4250。

### 提示:

NanoVTEP 探针可在软件版本为 9.2 或更高的所有 Keysight 307x 测试系统上安全使用。如果您所使用的软件版本早于 9.2,请直接联系测试系统制造商 Keysight。



## 一般数据

产品组: 开路测试  
 结构系列: OTU  
 类型: Keysight 无矢量测试  
 规格: nanoVTEP Gen2 SP 0.16 英寸  
 配件类型: 扩展配件  
 交付状态: 包括 nanoVTEP Gen2  
 宽度: 4 mm  
 高度: 48,7 mm  
 最小温度: 10 °C  
 最大温度: 60 °C  
 RoHS 符合性: 是

## 适用于

真空测试治具 (VA): VA 2070S/L  
 替换套件 (WS):

## 技术数据

行程: 4 mm  
 长度: 4 mm  
 外部尺寸(宽x深x高): 4 x 4 x 48,7 mm

## Accessories

Part no.	Designation	Version
108710	OTE-KS-NV-064-MUX	nanoVTEP signal conditioner board
108711	OTE-KS-NV-064-MUX-REF	nanoVTEP signal conditioner board ConnectCheck

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
 78467 Konstanz, 德国  
 中央办公室: +49 7531 8105-0  
 客户热线: +49 7531 8105-888  
 传真 +49 7531 8105-65  
 info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
 保留技術更改。03/26\_CN